## ZnCoO 稀磁半导体的室温磁性\*

王 漪<sup>†</sup> 孙 雷 韩德栋 刘力锋 康晋锋 刘晓彦 张 兴 韩汝琦

(2006年3月14日收到2006年7月5日收到修改稿)

采用固相反应法 將 ZnO 和 Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末按不同的成分配比混合 制备了稀磁半导体 Zn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O(x = 0.02, 0.06, 0.10)材料.并使用 H<sub>2</sub> 气氛退火技术对样品进行了处理 ,得到了具有室温铁磁性的掺 Co 氧化锌稀磁半导体.利用 全自动 X 射线衍射仪、X 射线光电子能谱仪、高分辨透射电子显微镜和超导量子干涉器件磁强计对样品的结构、晶 粒的尺寸、微观形貌以及磁性等进行了测量和标度.

关键词:稀磁半导体,氧化锌,掺杂,固相反应法 PACC:7550P,7280E,7630F

### 1.引 言

随着现代微电子技术的不断发展,自旋电子学 在微电子技术领域将具有广泛的应用前景1-31.在 自旋电子学与电子自旋相关的器件研究中 磁性半 导体被认为是利用电子自旋自由度制备微电子器件 的主要材料,其中氧化物稀磁半导体(oxide-diluted magnetic semiconductor )备受瞩目. 根据 Dietl 等<sup>4--6</sup>]的 理论预测,在具有宽禁带的氧化物半导体中(如 ZnO ,ZrO, ,TiO, 及 GaN 等) 掺入磁性离子后,有可能 制备出具有室温磁性的稀磁半导体.目前,氧化物稀 磁半导体研究主要集中在 ZnO 和 TiO, 等系统.不同 的研究小组利用不同的实验方法 如分子束外延、脉 冲激光淀积、反应溅射(reaction sputtering)以及溶胶-凝胶(sol-gel)等,在ZnO和TiO,中掺入过渡族磁性 离子 Co ,Mn 等 制备出了具有室温以上磁性的氧化 物稀磁半导体薄膜<sup>7-11</sup> 这些研究工作主要针对薄 膜的制备和磁性薄膜中磁性的起因等问题<sup>12,13]</sup>对 于氧化物稀磁半导体 ZnCoO 三维体材料室温磁性 的研究报道较少.因此,研究三维体材料的室温磁 性 对于今后制备高质量的二维氧化物稀磁半导体 薄膜以及探讨稀磁半导体的磁性起源都具有重要的 意义.

本文使用固相反应法制备了 ZnO 掺 Co 磁性体

材料(块材),通过 X 射线衍射(XRD)仪、X 射线光电 子能谱(XPS)分析仪、高分辨透射电子显微镜 (HRTEM)和超导量子干涉器件(SQUID)磁强计等, 对所制备的稀磁半导体材料进行了表征和分析.研 究了气氛退火对稀磁半导体材料磁性的影响,并发 现 H<sub>2</sub> 气氛退火可使所制备的稀磁半导体材料具有 室温磁性.

#### 2. 实 验

实验样品采用化学分析纯 ZnO 和 Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末, 按照 Zn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O 分子式的等价摩尔配比计算出 Co 含量 x 分别为 0.02 0.06 0.1 的配比.称料后,使用 QM-1SP2 型行星式球磨机在玛瑙罐中混料球磨 90 h 球磨料经烘干、研磨,并在 600 和 1000 ℃设反应 烧结点保温处理 10 h,再研磨压制成 20 mm×10 mm × 2.0 mm 的长方形样品,然后经相同的反应烧结点 固化烧结保温处理 5 h,随炉自然冷却至室温备用. 在 Ar 和 H<sub>2</sub> 的混合气体中 600 ℃温度下,对 x = 0.06的样品分别进行 1 3 h 的退火处理. Ar 和 H<sub>2</sub> 均为高 纯度, H<sub>2</sub> 分压比  $R = 0.1(R = P_{H_2}(P_{H_2} + P_{Ar})).$ 

使用 D/max2000 型全自动 XRD 仪确定样品的 结构和晶粒的尺寸,使用 MK II 型 XPS 仪和 H-9000NAR 型 HRTEM 分析观测样品的成分和微观形 貌等,使用 MPMS-XL7 型 SQUID 磁强计对样品进行

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号:10234010 ,60506009 )资助的课题.

<sup>†</sup> E-mail:wangyi@ime.pku.edu.cn

磁特性的测量和标度.

#### 3. 结果及讨论

图 1 为不同 Co 含量(x ≤ 0.02, 0.06, 0.1)的 Zn1-\*Co\*O 材料(H2 气氛退火前)与纯 ZnO 的 XRD 谱,从图1中可以明显地看到样品的结构与未掺杂 ZnO 纤锌矿结构相同 这说明 Co 掺入 ZnO 中并没有 破坏氧化锌的晶体结构, Co的掺杂浓度分别为 0.02 0.06 0.1 时 根据 Scherrer 公式

$$L = \frac{0.94\lambda}{\beta\cos\theta}$$

 $\pi 2d\sin\theta = \lambda$  由特征峰位(002)得到的相关数据, 计算出沿 c 轴方向的晶粒平均直径 d 分别为 44 46 和 47 nm 晶格长度分别为 0.2613 0.2601 和 0.2609 nm. 这里  $\lambda = 0.1542$  nm  $\beta$  为衍射峰的半高宽 (FWHM).*θ*为衍射角.

从上述结果可以看出 随掺杂浓度的增大 晶粒 的尺寸也增大,而晶格长度并没有变化,这是由于 Co离子的半径(0.072 nm)与 Zn离子的半径(0.074 nm)大小相差不大,离子替代后不会引起晶格长度 的明显变化.样品的制备是经长时间球磨混料和二 次成型法制得14〕,所以纳米晶粒的大小与材料密度 较为均匀.图2为Co掺杂浓度x = 0.06样品(H<sub>2</sub>气 氛退火前)的透射电子显微镜(TEM)和 HRTEM 照 片 图中显示出样品的纳米晶粒大小与材料的掺杂 较为均匀.



图 1 稀磁半导体  $Zn_{1-x}Co_xO$  材料的 XRD 谱

磁性能测量的样品 Co 掺杂浓度 x = 0.06.样品 首先经过 600 ℃烧结 ,再在 H。 气氛中分别退火 1 和

130 nm



图 2 Co 掺杂浓度 x = 0.06 的样品 TEM(a)和 HRTEM(b) 照片

3 h,H, 气氛退火温度为 600 ℃,Ar 和 H, 的分压比 均为 R = 0.1 其中样品 A 为经过 600 ℃烧结 在 H。 气氛中退火3h.样品 B 经过 1000 ℃烧结,然后在 600 ℃的 H, 气氛中退火 1 h, Ar 和 H, 的分压比为 R =0.1.H。气氛退火后,对片状样品的整体结构进行 了分析 发现样品中心部分与表面的颜色不同 表面 至中心 2/3 的部分颜色与表面是相同的,这表明 H, 气氛退火对样品的中心部分影响较小,对样品 A 和 样品 B 进行研磨得到粉体材料,使用该粉体进行磁 性测量得到的是平均值,测量结果如图3所示,从 图 3 可以看出 样品 A 和样品 B 在室温下都呈现 出完好的磁滞回线 这说明样品均明显表现出铁 磁性.在室温下 样品 A 的单个 Co 原子饱和磁化 强度为 0.056<sub>4/R</sub>(<sub>4/R</sub> 为 玻 尔 磁 子 ), 矫 顽 力 为 2.467 × 10<sup>4</sup> A/m. 样品 B 的单个 Co 原子饱和磁化强 度为 0.0007 μ<sub>B</sub> ,矫顽力为 1.695 × 10<sup>4</sup> A/m. 样品 A 的 零场和带场变温磁化强度随温度变化(M-T)曲线如

(a)

(b)

图 4 所示,测量温度范围为 10—300 K.测量结果显 示,在 300 K 时磁化强度不为零,所以样品的居里温 度  $T_c$ 高于室温,这也验证了图 3 所示样品 A 和样 品 B 在室温下表现为铁磁性.而且从 *M-T* 曲线的形 状初步判断,样品 A 的铁磁性并非来源于 Co 颗粒 或 Co 的团簇,因为 *M-T* 曲线没有出现明显的阻断 (blocking)现象<sup>[15]</sup>和自旋玻璃性(spin-glass)的' $\lambda$ '形 状<sup>[16]</sup>.图 4 内插图为样品 A 未经 H<sub>2</sub> 气氛退火的*M-T* 曲线,当温度由 10 K 升高至 300 K 时,*M-T* 曲线满 足居里 – 外斯定律.图中的实线由下式表示:

$$\chi = C(T + \theta_0)$$
,

式中, $C = (2.11 \pm 0.03)$ m·K/kg, $\theta_0 = 13.7 \pm 0.5$ K.样品 A 在室温下测得的磁滞回线为直线,故样品 A 在 H<sub>2</sub> 气氛处理前表现出顺磁性.



图 3 样品 A 在 10 和 300 K 时测得的磁滞回线 内插图为样品 B 在 300 K 时测得的磁滞回线

为了进一步探讨样品中磁性的来源以及是否存 在 Co 颗粒或 Co 的团簇,我们对样品 A 进行了 XPS 测试.分析了 H<sub>2</sub> 气氛退火前后样品的成分及化合 价态,结果如图 5 所示.图 5 中的曲线 *a* 为样品经 H<sub>2</sub> 气氛退火 3 h 后,曲线 *b* 为 H<sub>2</sub> 气氛退火前 Co 的 高分辨 XPS 谱.由 XPS 谱可知,H<sub>2</sub> 气氛退火前 Co 的 高分辨 XPS 谱.由 XPS 谱可知,H<sub>2</sub> 气氛退火前后 Co 的  $2p_{1/2}$ 和  $2p_{2/3}$ 两个峰位没有发生明显的变化.以样 品 A 为例,Co 的  $2p_{1/2}$ 和  $2p_{2/3}$ 的位置分别位于 779.78 和 795.18 eV,两能级之间的差为 15.40 ± 0.15 eV.因 此,排除了存在 Co 颗粒或 Co 团簇的可能性.因为若 存在 Co 颗粒或 Co 团簇,其 Co 的  $2p_{1/2}$ 和  $2p_{2/3}$ 峰位之 间的能级差应为 15.05 eV<sup>[15]</sup>.此外,如果 Co<sup>2+</sup>均匀 地被四面体 O 包围,Co 的  $2p_{1/2}$ 和  $2p_{2/3}$ 峰位之间的能 级差为 15.5 eV<sup>[15]</sup>.对于样品 B,XPS 测试也得出相



图 4 样品 A 的零场和带场变温 *M-T* 曲线 内插图为样品 A 在 H<sub>2</sub> 气氛退火前的磁化率随温度变化曲线,实线为居里-外斯定律 的计算结果

同的结果,没有表现出 Co 颗粒或 Co 团簇.因此,我 们可以排除 Co 颗粒或 Co 团簇存在的可能性.由 XRD(图1)和 *M-T*(图4)以及 XPS(图5)的结果分析 表明:XRD显示在制备的样品中 Co 部分替换了2价 的 Zn 得到了掺杂均匀的 ZnCoO 样品;而 *M-T* 中在 低温段没有发现曲线的跳变现象,在 XPS 中也没有 发现 Co 的  $2p_{1/2}$ 和  $2p_{2/3}$ 峰位之间的能级差,所以我们 认为样品中 Co 主要以 + 2 价的形式存在<sup>[17]</sup>.



图 5 样品 A 在 H<sub>2</sub> 气氛退火前后 Co 的 2p XPS 曲线 *a* 为样品 经 H<sub>2</sub> 气氛退火 3 h,曲线 *b* 为 H<sub>2</sub> 气氛退火前

对于样品中所观察到的磁性起源,根据 M-T 和 XPS 测试结果分析,可以排除 Co 颗粒或 Co 团簇引 起的铁磁性.我们利用 XRD 检测了 Co 掺杂浓度 x= 0.06、烧结温度为 600 ℃的样品在 H<sub>2</sub> 气氛退火前 后的组分变化情况,结果如图 6 所示.在图 6 中,曲



图 6 Co 掺杂浓度 x = 0.06 样品经 H<sub>2</sub> 气氛退火前后的 XRD 谱 曲线 a 为 600 ℃烧结、600 ℃ H<sub>2</sub> 气氛退火 3 h 的结果 ;曲线 b 为 600 ℃烧结、600 ℃ H<sub>2</sub> 气氛退火 1h 的结果 ;曲线 c 为 600 ℃烧 结、未经 H<sub>2</sub> 气氛退火的结果.最下方的曲线为纯 ZnO 谱

线 a 为 600 ℃烧结、600 ℃ H<sub>2</sub> 气氛退火 3 h 的结果; 曲线 b 为 600 ℃烧结、600 ℃ H<sub>2</sub> 气氛退火 1 h 的结 果;曲线 c 为 600 ℃烧结、未经 H<sub>2</sub> 气氛退火的结果. 对于未经 H<sub>2</sub> 气氛退火的样品,XRD 检测出了极少 量的 Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub>,该样品经 H<sub>2</sub> 气氛退火后显示出了微弱 的 Co 峰.综合以上 *M*-T、XRD 以及 XPS 实验结果的 分析得出,所制备的 ZnCoO 稀磁半导体材料中,没 有 Co 颗粒或 Co 团簇的存在,磁性并非来源于 Co 颗 粒或 Co 的团簇.有研究者认为,样品很有可能是纳 米晶粒,而样品中 Co 掺杂在各个氧化物半导体纳米 晶粒内,这种掺杂形式使得 Co 元素不容易析出形成 Co 颗粒<sup>[18]</sup>.

55 卷

#### 4. 结 论

采用固相反应法制备了掺杂配比不同的 Zn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>O稀磁半导体材料.样品在空气中退火后为 顺磁性,但经 H<sub>2</sub> 气氛退火后,样品在室温下具有明 显的铁磁性.零场和带场变温 *M-T* 曲线、XPS 分析 以及 XRD 测试结果表明,样品中没有 Co 颗粒或 Co 团簇的存在,所以铁磁性并非来源于 Co 颗粒或 Co 的团簇.实验结果表明,样品的制备工艺对材料铁磁 性有直接影响,而 H<sub>2</sub> 气氛退火工艺是一种较为可 行的手段.

对中国科学院物理研究所表面物理国家重点实验室在 XPS测量分析上给予的帮助及北京大学大型仪器开放测试 基金的支持表示感谢.

- [1] Prinz G A 1998 Science 282 1660
- [2] Ohno H 2001 Science 291 840
- [3] Wolf S A , Awschalom D D , Buhrman R A et al 2001 Science 294 1488
- [4] Dietl T , Ohno H , Matsukura F et al 2000 Science 287 1019
- [5] Dietl T , Ohno H , Matsukura F 2001 Phys. Rev. B 19 6319
- [6] Dietl T 2002 Semicond . Sci . Technol . 17 377
- [7] Ueda K , Tabata H , Kawai T 2001 Appl . Phys . Lett . 79 988
- [8] Radovanovic P V, Gamelin D R 2003 Phys. Rev. Lett. 91 157202
- [9] Park J H, Kim M G, Jang H M et al 2004 Appl. Phys. Lett. 84 1338
- [10] Chambers S A, Droubay T, Wang C M et al 2003 Appl. Phys. Lett. 82 1257
- [11] Zhou X, Wang S Q, Lian G J et al 2006 Chin. Phys. 15 199
- [12] Hong N H, Ruyter A, Prellier W et al 2004 Appl. Phys. Lett. 85 6212

- [13] Kuang A L, Liu X C, Lu Z L *et al* 2005 *Acta Phys*. *Sin*. **54** 2934 (in Chinese)[ 匡安龙、刘兴 、路忠林等 2005 物理学报 **54** 2934]
- [14] Qin X J, Shao G J, Liu R P et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 2409 (in Chinese)[秦秀娟、邵光杰、刘日平等 2005 物理学报 54 2409]
- [15] Lee H J, Jeong S Y, Cho C R et al 2002 Appl. Phys. Lett. 81 4020
- [16] Shand P M , Christianson A D , Pekarek T M et al 1998 Phys. Rev.
  B 58 12876
- [17] Martinez B, Sandiumenge F, Balcells L et al 2005 Phys. Rev. B 72 165202
- [18] Song H Q, Chen Y X, Ren M J et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 369 (in Chinese)[宋红强、陈延学、任妙娟等 2005 物理学报 54 369]



# Room-temperature ferromagnetism in Co-doped ZnO diluted magnetic semiconductor \*

Wang Yi<sup>†</sup> Sun Lei Han De-Dong Liu Li-Feng Kang Jin-Feng Liu Xiao-Yan Zhang Xing Han Ru-Qi

(Institute of Microelectronics, Peking University, Beijing 100871, China)

( Received 14 March 2006 ; revised manuscript received 5 July 2006 )

#### Abstract

The room-temperature ferromagnetism (RTFM) of Co-doped zinc oxide are reported in this paper. The  $Zn_{1-x} Co_x O$  (x = 0.02, 0.06, 0.10) specimens were synthesized by solid state reaction of the mixture of ZnO and  $Co_2 O_3$  powders. The specimens were then annealed in the hydrogenation ambience. The RTFM was found in the hydrogenated samples , and the hysteresis loops of the hydrogenated Co-doped ZnO samples were measured at 300 K by using the superconducting quantum interference device magnetometer. The samples were further measured by X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, and high-resolution transmission electron microscopy.

Keywords : diluted magnetic semiconductor , ZnO , doping , solid state reaction PACC : 7550P , 7280E , 7630F

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10234010, 60506009).

<sup>†</sup> E-mail:wangyi@ime.pku.edu.cn